SEIWA OPTICAL

半導体カセット寸法検査装置

Wafer cassette inspection system

Selfie

FSMシリーズ

"FSM" Series

FOR SEMICONDUCTOR

Feature

- 各種メーカーのFOUP/FOSB/OCに対応
  φ300mmの定型サイズ以外やカラーカセットも検査可能
- 2500万画素カメラ＋専用光学エンジンにより、
  超高画質での外径寸法を可能に！
- 超広視野で行う高速処理でスループットは業界最速

～特注対応も行っております。お気軽にご相談下さい。～

株式会社 清和光学製作所

SEIWA OPTICAL

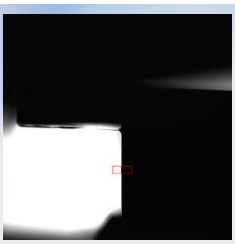
半導体周辺機器検査の新スタンダード

INSPECTION SYSTEM

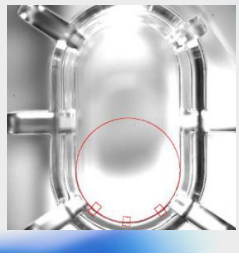
【概要】
FOUP/FOSB/OCの外径寸法測定を行う装置です（ウェハ挿入済み可）。
様々な角度から、トップフランジ、サイドフォークリフトフランジ、
ウェハ搭載の段ピッチやレジストレーションピンホールを測定・検査します。

【特徴】

高画質
2500万画素カメラ搭載
画素分解能6μm/pix

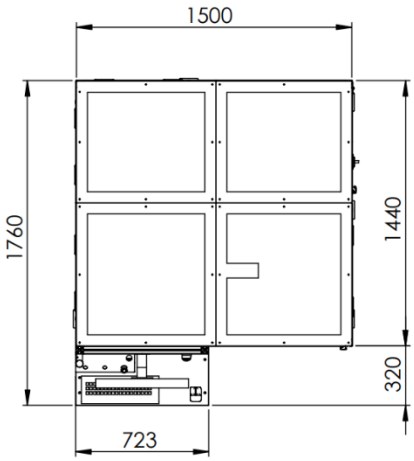


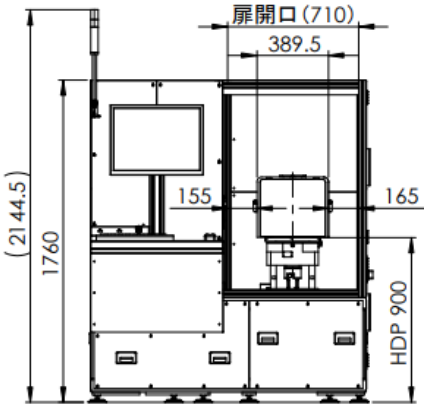
高速スループット
広視野撮像によって
タクトを短縮
大幅な高速化を実現

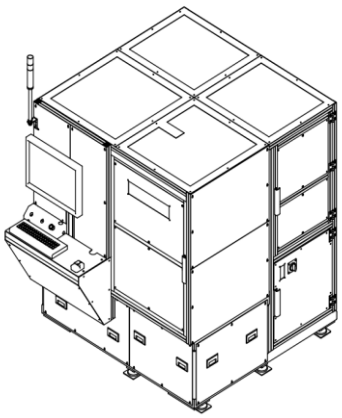


【仕様】

ワーク種類	： FOUP/FOSB/OC ※適用カセットの詳細をご提示ください。
搬送	：オペレータによるマニュアル設置 検査中のカセット蓋の開閉は自動で行います。







株式会社 清和光学製作所

【お問合せ先】E-mail: sales@seiwaopt.co.jp

本社　：〒164-0013 東京都中野区弥生町4-12-17　TEL:03-3383-6301/FAX:03-3383-6304
上野原事業所　：〒409-0112 山梨県上野原市上野原8154-41　TEL:0554-63-5211/FAX:0554-63-5213
関西事業所　：〒573-0128 大阪府枚方市津田山手2-17-10　TEL:072-808-0550/FAX:072-808-0650
長野事業所　：〒399-0737 長野県塩尻市大門八番町9-3　TEL:0263-51-0710/FAX:0263-51-0718
福岡営業所　：〒813-0042 福岡県福岡市東区舞松原1-12-10　TEL:092-410-8616/FAX:092-410-8617

http://www.seiwaopt.co.jp